

# サイバネットシステム オプティカル事業部 取扱い測定器一覧

## 散乱測定 表面反射測定



高精度散乱測定器  
REFLET



表面反射アナライザー  
RA-532H



小型簡易散乱測定器  
Mini-Diff V2



2D分光放射計  
SR-5000

## 配光測定 ビーム測定



高速ニアフィールド配光測定システム  
GP-7



大口徑・高出力対応  
ビームプロファイラ  
LaseView-LHB100



分光膜厚測定システム  
Fシリーズ

## 表面形状測定 膜厚測定



3D表面形状測定システム  
Profilm3D

### 高精度散乱測定器：REFLET

任意の測定サンプルの、2D/3Dの散乱分布(BRDF/BTDF)を自動で高速に測定するコンパクトで高精度な測定器です。

測定データは、LightToolsやLucidShapeなどの照明系シミュレーションツールに取込み可能な形式でファイル出力することができます。



### 小型簡易散乱測定器：Mini-Diff V2

市場における散乱測定器の中では圧倒的に手頃な価格であり、場所を取らない扱いやすいサイズで、簡単に素早く散乱分布を測定できます。

測定データは、LightToolsなどの照明系シミュレーションツールに取込み可能な形式でファイル出力することができます。



### 表面反射アナライザー：RA-532H

1回の測定で、光沢度、ヘイズ、写像性、BRDF(2次元)の、4つの指標を一度に出力します。

観測カメラが搭載されており、実際の測定箇所が装置表示部のモニターに表示されるため、どの角度でも、測定したい箇所を正確に測定できます。



### 2D分光放射計：SR-5000

点測定分光放射計と同等の性能を有した、面測定可能な分光放射計です。測定データを専用ソフトに取込むことで、任意のエリア毎のスペクトル分布の比較や、特定波長における輝度分布の確認を行うことができます。



### 高速ニアフィールド配光測定システム：GP-7

光源や光学材料の配光を極めて高速に測定するコンパクトな装置です。

測定データは、一般的なIES形式でのファイル出力以外にも、LightToolsやZemax, TracePro, ASAPなどの照明系シミュレーションツールに取込み可能な形式でファイル出力することができます。



### 大口径・高出力対応ビームプロファイラ：LaseView-LHB100

世界で最も大きなビームを測定できる類を見ない製品です。多数のLEDや半導体レーザーの同時発光評価などにも使用できます。

ソフトウェアはユーザビリティが高いと評価されているLaseViewを採用しています。各種解析機能を備えています。



### 3次元表面形状測定システム：ProfilM3D

垂直走査白色干渉法と位相シフト干渉法を組み合わせ、ナノレベルの精度で粗さ・段差などの表面形状を非接触で測定します。

高精度の白色干渉方式の測定システムでありながら低価格を実現しています。



### 非接触分光膜厚測定システム：Fシリーズ

光の干渉を利用した反射率分光方式の非接触膜厚測定システムです。

光の照射により測定サンプルの表面から反射した光と、境界面から反射した光とが干渉して生じた干渉スペクトラムを基に、膜厚を解析します。



## 参考資料

[【資料ダウンロードはこちら】](#)  
[「光学測定ソリューションによって実現する  
高精度の照明シミュレーションと実物評価」](#)

## お問い合わせ

サイバネットシステム株式会社 オプティカル事業部



03-5297-3703



optsales@cybernet.co.jp